

## 8935

고 생산성 패턴 웨이퍼 검사 시스템은 반도체 칩의 수율 및 신뢰성에 영향을 미치는 다양한 중대 결함을 검출합니다.

## 혜택 :

- 8935는 높은 처리량, 인라인 결함 검출 및 분류 기능을 제공하여 자동차 반도체 칩 제조업체를 지원합니다.
- 최종 반도체 칩 품질에 영향을 줄 수 있는 생산 공정 문제를 정확하게 식별하고 신속하게 해결합니다.
  - 중요한 공정 단계에서 모든 웨이퍼의 다이를 100% 모니터링함으로써 공급망에서 고장날 수 있는 다이를 최저비용으로 제거하는 제로 결함 선별 전략을 구현합니다.
  - 중대한 결함을 구분하고 처리량을 감당해내는 검사 민감도와 AI 기술, 모니터링 및 선별 응용을 제공하는 확장가능하고 비용 효율적인 플랫폼 제공하여 새로운 소자를 생산하고 더 작은 설계 노드로 이동합니다.

## 기술 :

- 높은 NA 광학계를 구비한 다중 모드 LED 스캐닝 기능
- 고해상도 작동 모드
- DefectWise® AI 기반 결함 검출 및 분류 기술
- DesignWise™ 및 FlexPoint™ 정밀 영역 검사 기술
- 고급 노이즈 억제 알고리즘
- I-PAT® 인라인 선별 해결책

## 응용 분야 :

- 높은 로트 및 웨이퍼 샘플링을 통한 인라인 공정 모니터링으로 이상 위험 감소
- 공정 설비 모니터링
- 최종 패턴 웨이퍼의 출하 품질 관리
- I-PAT와 완전 자동화 다이 수준 선별 해결책



## 시장 :

자동차, IoT, 5G, 가전 제품, 산업(군사, 항공 우주, 의료)용 더 큰 설계 노드 소자에 들어가는 반도체 칩 제조

## 플랫폼 :

- 맞춤형 구성
- 확장 가능
- 업그레이드 가능

## 웨이퍼 크기 :

- 300mm
- 200mm
- 150mm

## 추가 정보 :

[www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-8-series](http://www.kla.com/products/chip-manufacturing/defect-inspection-review#product-8-series)